

#### 文仙 啓吾, 高山 直輝, 岡田 健一, 松澤 昭

## 東京工業大学大学院理工学研究科 電子物理工学専攻



2009/09/16



- 背景
- ディエンベディングと従来手法
- ・提案手法と実測データへの適用
- まとめ

K. Bunsen, Tokyo Tech



1

ΤΕΓΗ

Pursuing Excellence

ΤΟΚΥΟ

#### 背景



[2] 総務省 電波利用HP http://www.tele.soumu.go.jp/index.htm

2

Matsuzawa 🛄 & Okada Lab.

2009/09/16

ディエンベディング

伝送線路,キャパシタ,トランジスタ等,必要な素子を試作して測定 」
別定技術が重要

測定結果をモデル化し、シミュレーションに組み込む



#### 高周波では測定パッドの 寄生成分の影響がより大きい

## パッドの影響を取り除く作業 ディエンベディング



3

2009/09/16

従来手法

• Open-Short法

オープンとショートのパッドのダミーパターンを計測し、

寄生成分を計算する オープン・ショートのダミー パターンの非理想性が問題



- Thru-Only法
  - パッドを出来るだけ近づけてパッドのみの影響を計測する プローブ間の干渉が問題 <sup>60</sup>





K. Bunsen, Tokyo Tech

Matsuzawa 👘 🕺

ΓΕΓ

Pursuing Excellence

ΓΠΚ



オープン・ショートのダミーパターンを使用しない

プローブ間の干渉を避けるため距離を離す





[3]Alain M. Mangan, Sorin P. Voinigescu, Ming-Ta Yang and Mihai Tazlauanu, "De-Embedding Transmission Line Measurements for Accurate Modeling of IC Designs,"IEEE Trans. on Electron Devices, vol. 53, no. 2, pp. 235-241, Feb. 2006.

2009/09/16

K. Bunsen, Tokyo Tech



5

ΤΟΚΥΟ ΤΙΕΓΗ

**Pursuing Excellence** 

# 伝送線路のディエンベディング



6











伝送線路のみの特性



2009/09/16

# 並列寄生成分の計算

ΓΟΚΥΟ ΤΙΞΓΙ-Ι 測定データ Pursuing Excellence Zs  $\mathbf{Y} |_{z_p} |_{\ell^-}$  $\mathbf{Y}_{\mathbf{X}} =$ Ζp  $\mathbf{Y}_{TL}^{m} = \begin{bmatrix} \frac{Z_{S} + Z_{1}'}{\Delta Z'^{2}} + \frac{1}{Z_{P}} & \frac{Z_{2}'}{\Delta Z'^{2}} \\ \frac{Z_{2}'}{\Delta Z'^{2}} & \frac{Z_{S} + Z_{1}'}{\Delta Z'^{2}} + \frac{1}{Z_{P}} \end{bmatrix}$  $\mathbf{Y}_{\mathbf{TL}} = \begin{vmatrix} Y_{TL1} & Y_{TL2} \\ Y_{TL2} & Y_{TL1} \end{vmatrix}$  $\Delta Z'^{2} = (Z_{s} + Z_{1}')^{2} - Z_{2}'$  $\Delta Y_{TL} Z_1' = Y_{TL1} \quad \Delta Y_{TL} Z_2' = Y_{TL2}$ Т  $\sim 1$ 

$$\left|\frac{1}{Z_{P} \cdot (Y_{TL1} + Y_{TL2})} \cdot \left(1 + \frac{1}{Z_{s} \cdot (Y_{TL1} + Y_{TL2})}\right)\right| >> 1 \quad \text{が成り立つとき}$$
$$\mathbf{Y}_{\mathbf{X}}(\mathbf{1},\mathbf{1}) + \mathbf{Y}_{\mathbf{X}}(\mathbf{1},\mathbf{2}) \approx \frac{1}{Z_{p}}$$

Matsuzawa 👘 🚯 🕹

# 直列寄生成分の計算

**DIFECH** PursuingExcellence

ΓΟΚ

8



切片の値がパッドの直列寄生成分に対応

$$Z_s = \frac{1}{2} \cdot \left( R_0 + j \omega L_0 \right)$$

以上でパッドの寄生成分を求めることが出来た



# 実測データへの適用

- 長さが 200µm, 300µm, 400µm の3
   本の伝送線路で測定
- 200µm, 400µmの測定データからパッドの寄生成分を求め,それぞれの伝送線路に対してディエンベディング



今回用いたパッドの構造



今回用いた伝送線路の構造



9

TECH

**Pursuing Excellence** 

ΓΠΚ

2009/09/16

ディエンベディング結果



異なる長さの伝送線路の特性インピーダンスの差が約1Ω以内におさまった



10

Pursuing Excellence

ΓΟΚ

まとめ

Pursuing Excellence

複数の伝送線路を用いたディエンベディング手法を提案

 実測データに適用したところ,異なる長 さの伝送線路の特性インピーダンスの 差が1Ω程度となり,従来手法の3Ω程度 と比べて,差を小さくすることが出来た



- [1] Rec. ITU-R P.676-2, Feb. 1997
- [2] 総務省 電波利用HP http://www.tele.soumu.go.jp/index.htm
- [3] Alain M. Mangan, Sorin P. Voinigescu, Ming-Ta Yang and Mihai Tazlauanu, "De-Embedding Transmission Line Measurements for Accurate Modeling of IC Designs,"IEEE Trans. on Electron Devices, vol. 53, no. 2, pp. 235-241, Feb. 2006.



ΤΟΚ

#### 伝送線路の伝播定数





13

TECH

**Pursuing Excellence** 

ΤΟΚΥΟ

2009/09/16





K. Bunsen, Tokyo Tech



14

## 理想伝送線路への適用

200um 理想伝送線路 um **- 400**um 特性 インパーダンス[ frequency[GHz]

K. Bunsen, Tokyo Tech



ΤΟΚΥΟ ΤΙΕΓΗ

**Pursuing Excellence**